Спектры и квантовый выход излучения светодиодов с квантовыми ямами на основе гетероструктур из GaN — зависимость от тока и напряжения *

© В.Е. Кудряшов, С.С. Мамакин, А.Н. Туркин, А.Э. Юнович[¶], А.Н. Ковалев⁺, Ф.И. Маняхин⁺

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (физический факультет),

⁺ Московский институт стали и сплавов,

117936 Москва, Россия

(Получена 27 ноября 2000 г. Принята к печати 29 ноября 2000 г.)

Исследованы квантовый выход и спектры люминесценции светодиодов на основе гетероструктур InGaN/AlGaN/GaN с множественными квантовыми ямами в диапазоне токов $J = 10^{-6} - 10^{-1}$ А. Светодиоды фирмы Hewlett Packard имели небольшой разброс квантового выхода излучения (±15%) при рабочих токах ($J \approx 10$ мА). Различия связаны с разной зависимостью интенсивности излучения от тока и напряжения вследствие различия распределения заряженных центров в области пространственного заряда структур и разной роли туннельной компоненты тока при малых напряжениях. При $J \leq 100$ мкА в диодах с малой толщиной области пространственного заряда (≤ 120 нм) обнаружена полоса туннельного излучения, энергетическое положение максимума которой $\hbar\omega_{max} = 1.92 - 2.05$ эВ соответствует напряжению. Положение основного максимума $\hbar\omega_{max} = 2.35 - 2.36$ эВ в спектрах при малых токах (J = 0.05 - 0.5 мА) не зависит от напряжения и объясняется излучательными переходами в локализованных состояниях. Спектральная полоса сдвигается с током при J > 1 мА ($\hbar\omega_{max} = 2.36 - 2.52$ эВ); форма полосы описана в модели заполнения хвостов двумерной плотности состояний, обусловленных флуктуациями потенциала. Рассчитана энергетическая диаграмма структуры с множественными квантовыми ямами, которая объясняет 4 параметра модели рекомбинации в хвостах двумерной плотности состояний.

1. Введение

Проблемы механизмов рекомбинации в светодиодах (СД) на основе сложных гетероструктур типа InGaN/AlGaN/GaN с квантовыми ямами [1] подробно обсуждались в работах [2–6], а также в работах [7–9]. В [2–5] были исследованы СД с одиночными и множественными квантовыми ямами (ОКЯ и МКЯ), присланные из лабораторий фирм Nichia и Toyoda Gosei.

В настоящей статье изложены результаты исследований зеленых СД с МКЯ из лаборатории фирмы Hewlett Packard. Было интересно исследовать спектры излучения, вольт-амперные характеристики (ВАХ) и динамические вольт-фарадные характеристики (ВФХ) в широком диапазоне токов J с целью установить корреляцию между квантовым выходом излучения при рабочих токах ($J \approx 10$ мА), распределением заряженных центров в области пространственного заряда и ролью туннельной компоненты тока.

Для обсуждения результатов и количественного анализа формы спектров оказалось необходимым рассчитать энергетическую диаграмму гетероструктур типа InGaN/AlGaN/GaN с МКЯ и использовать различные модели излучательной рекомбинации, в частности модель рекомбинации в двумерных (2D) структурах с хвостами плотности состояний.

2. Методика эксперимента

Были исследованы образцы зеленых СД на основе гетероструктур $In_xGa_{1-x}N/Al_yGa_{1-y}N/GaN$ [6], выращенных методом газофазной эпитаксии из металлорганических соединений на сапфировых подложках. Активным слоем в структурах были МКЯ In_xGa_{1-x}N/GaN $(x \approx 0.30 - 0.35, 5$ периодов, период < 8 нм). Образцы были разделены на 3 группы по 20 штук в каждой, различающиеся по силе света при токе $J = 10 \,\mathrm{mA}$ $(\pm 10\%)$: 1.2 кд (Q), 1.0 кд (N) и 0.9 кд (P). Было исследовано несколько СД из каждой группы; подробные данные при комнатной температуре в диапазоне токов $J = 10^{-7} - 3 \cdot 10^{-2}$ А получены для 2 СД из каждой группы. Методика измерений спектров люминесценции и электрических свойств описана в работах [2,4]. Внешний квантовый выход излучения $\eta_e(J)$ и коэффициент полезного действия $\eta_P(J)$ СД определялись из измерений мощности излучения.

3. Экспериментальные результаты

3.1. Спектры люминесценции светодиодов при постоянных токах

Спектры излучения СД (Q, N, P) при комнатной температуре имели максимумы в интервале энергий $\hbar\omega_{\max} = 2.35 - 2.52$ эВ и ширину на половине высоты $\Delta\hbar\omega_{1/2} \approx 0.21 - 0.23$ эВ (по шкале длин волн $\Delta\lambda_{1/2} = 36 - 38$ нм) (рис. 1). Для СД типа Q спектры показаны для токов от $J \approx 1.25$ мкА (1, a), для N — от 20 мкА (1, b), для P — от 60 мкА (1, c).

¹¹⁹⁸⁹⁹ Москва, Россия

^{*} Работа частично доложена на 3-м Всероссийском совещании "Нитриды галлия, индия и алюминия: структуры и приборы" (М., МГУ, 1999), на 3-й Международной конференции по нитридным полупроводникам (ICNS-3, Montpellier, 1999) и на 4-м Европейском совещании по нитриду галлия (EGW-4, Nottingham, 2000).

[¶] E-mail: yunovich@scon175.phys.msu.su



Рис. 1. Спектры электролюминесценции СД с множественными квантовыми ямами типов Q(a), N(b), P(c) и их аппроксимация (точки). a: спектры (снизу вверх) соответствуют токам J = 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 50 мкА, 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 20 мА, аппроксимация — J = 10 мкА, 0.1, 1, 10 мА. b: спектры (снизу вверх) соответствуют токам J = 20, 30, 50, 100 мкА, 0.15, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15 мА, аппроксимация — J = 0.15, 1, 15 мА. c: спектры (снизу вверх) соответствуют токам J = 20, 30, 50, 100 мкА, 0.15, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15 мА, аппроксимация — J = 0.15, 1, 15 мА. c: спектры (снизу вверх) соответствуют токам J = 60, 80 мкА, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20 мА, аппроксимация — J = 0.2, 2, 20 мА. Стрелками показаны характерные значения энергий, обсуждаемые в тексте.

В зависимости от *J* в спектрах можно выделить три области. Спектральные максимумы сдвигаются с напряжением при больших токах (J > 1 мА, $\hbar\omega_{\rm max} = 2.35-2.52$ эВ). Это наблюдалось и ранее для зеленых СД с ОКЯ и МКЯ [2–6]. Эта основная полоса в спектрах описывается в модели излучательной рекомбинации в хвостах 2D плотности состояний, обусловленных флуктуациями потенциала [2–6]. В области 0.1 < J < 1 мА максимумы не зависели от тока, $\hbar\omega_{\rm max} = 2.35-2.36$ эВ.

В области малых токов интенсивности излучения для диодов из разных групп отличаются на два-три порядка. При J < 70 мкА для диодов N и P была обнаружена слабая спектральная полоса, положение максимума которой сдвигается приблизительно так же, как и напряжение на диоде, $\hbar\omega_{\rm max} = 1.92 - 2.04$ эВ. Эта полоса аналогична исследованной ранее полосе туннельного излучения для голубых светодиодов с ОКЯ в области $\hbar\omega_{\rm max} = 2.1 - 2.3$ зВ [3].

3.2. Вольт-амперные характеристики и распределение зарядов в структуре

Распределение концентрации заряженных акцепторных центров (N_A^-) в зависимости от расстояния (x) показано на рис. 2 для диодов Q, N и P (на рисунке слева от x = 0 — n-область). Оно было определено из измерений динамической емкости (см. методику в [5]). Распределение зарядов показывает существование в гетероструктуре компенсированной области и областей пространственного заряда, что важно для последующего обсуждения (п. 4.1.1). Компенсированная область (80–150 Å) больше, чем в диодах с ОКЯ [2,3]. Ширина



Рис. 2. Распределение заряженных центров в зависимости от расстояния $N_A^-(x)$ в *p*-области светодиодов: *1*, 2 — голубой и зеленый СД с ОКЯ (Nichia); *3*, 4 — голубой и зеленый СД с МКЯ (Toyoda Gosei); *5*, *6*, 7 — зеленые СД с МКЯ *N*, *P*, *Q* (Hewlett Packard).

Физика и техника полупроводников, 2001, том 35, вып. 7



Рис. 3. Вольт-амперные характеристики СД Q(a), P(b), N(c). Для кривых b и c шкала ординат смещена соответственно на 2 и 4 десятичных порядка. Вертикальными линиями отмечены характерные значения напряжений, обсуждаемые в тексте.

компенсированной области для диодов N и P при нулевом напряжении, U = 0, ($\lesssim 120$ Å) меньше, чем для диодов Q (~ 200 Å). Диоды разных серий различаются и концентрацией заряженной примеси в p-области: $2 \cdot 10^{17}$, $5 \cdot 10^{17}$ и 10^{18} см⁻³ для образцов P, N и Q соответственно. Распределение зарядов для СД Q близко к данным для зеленых СД фирмы Toyoda Gosei [5].

Вольт-амперные характеристики СД из трех групп (Q, N, P) представлены на рис. 3. На кривых можно выделить четыре области, разграниченные особыми точками по напряжению U. В области U = 1.92 - 2.54 В (область III) во всех трех типах СД доминирует инжекционный механизм; ВАХ имеет наклон $E_J = dU/d(\ln J) \approx 70-80$ мэВ. Выше по напряжению лежит область IV, в которой сказывается последовательное сопротивление $R_s \approx 20$ Ом. Область II туннельной излучательной рекомбинации присутствует в СД N от 1.03 до 1.92 В и в СД P в более широком диапазоне, от 0.3 В (доли нА) до 1.92 В; наклон ВАХ здесь равен $E_{T0} \approx 120$ мэВ. В СД Q туннельная излучательная полоса не проявляется из-за более широкой компенсированной области (рис. 1, а, 2). При меньших токах лежит область І туннельной безызлучательной рекомбинации; в этой области ВАХ имеет одинаковый наклон $E_T \approx 85$ мэВ для всех типов СД.

3.3. Квантовый выход излучения в зависимости от напряжения и тока

На рис. 4 показана зависимость мощности излучения от тока для трех СД (Q, N и P), а на рис. 5 — определенные из этих данных зависимости коэффициента полезного действия, $\eta_P(J) = \eta_e(J)\hbar\omega_{\max}/$ эВ, от тока. Эта зависимость немонотонна и максимум η_P приходится

на напряжение U = 2.6-3.2 В. Следует заметить, что максимум η_P для СД Q больше ($\eta_{max} = 1.8-2.4\%$) и имеет место при меньших токах ($J \approx 0.5-1.0$ мА), чем для СД N и P ($J \approx 8-12$ мА; $\eta_{max} = 1.2-1.4\%$). Связь $\eta_e(J)$ с параметрами описания спектров обсуждается далее (см. п. 4.4).

4. Обсуждение результатов

4.1. Энергетическая диаграмма гетероструктур

Работы [7,8] показали, что гетероструктуры могут быть сильно неоднородными, особенно это относится к распределению In в квантовой яме. В слоях InGaN может происходить разделение твердого раствора на фазы с различным содержанием In. Такая неоднородность может приводить к флуктуациям потенциала и ширины запрещенной зоны по плоскости квантовой ямы (микронеоднородности) или к возникновению "квантовых точек", "квантовых островков" или сегментированных квантовых ям (макронеоднородности).



Рис. 4. Мощность излучения СД Q (*a*), *P* (*b*), *N* (*c*) в зависимости от тока.



Рис. 5. Коэффициент полезного действия СД Q (a), P (b), N (c) в зависимости от тока.



Рис. 6. Энергетическая диаграмма гетероструктуры AlGaN/InGaN/GaN с квантовыми ямами. Пунктирная линия — диаграмма при прямом напряжении U = 2.36 В. Стрелками показаны характерные значения энергий, обсуждаемые в тексте.

Спектры электролюминесценции СД хорошо описывались двумерной моделью, в которой были учтены флуктуации потенциала [2–6]. Поэтому для расчета энергетической диаграммы гетероструктуры мы будем использовать двумерную модель. Флуктуации потенциала оценим варьированием параметров двумерной модели (и таким образом учтем существенную роль микронеоднородностей).

4.1.1. Распределение потенциалов. Падение потенциала в p-n-переходе было рассчитано в предположении, что в структуре имеются три области [4–6]: области пространственного заряда со стороны p- и n-слоев, компенсированная *i*-область постоянного электрического поля $E_{\rm max}$ между ними. Предполагалось, что концентрации заряженных доноров Si⁺ и акцепторов Mg⁻ в областях пространственного заряда постоянны.

Падения потенциалов φ_n и φ_p в *n*- и *p*-области в таком предположении обратно пропорциональны концентрациям доноров $(N_d^+ \approx 10^{19} \text{ см}^{-3})$ и акцепторов $(N_a^- \approx 10^{18} \text{ см}^{-3})$: $\varphi_n/\varphi_p = N_a^-/N_d^+$. Поскольку $N_d^+ \gg N_a^-$, бо́льшая часть контактного потенциала φ_k падает в *p*-области. Величина φ_p соответствует барьеру в слоях *p*-GaN/*p*-AlGaN, который необходимо преодолеть дыркам, чтобы попасть в активную область с квантовыми ямами (рис. 6).

Строгий расчет должен принимать во внимание изменение с потенциалом (соответственно с расстоянием) степени заполнения акцепторных состояний дырками, поскольку энергия ионизации Mg в GaN достаточно велика: $\Delta E_A(Mg) = 0.22$ эВ [1].В наших расчетах эффективная энергия ионизации акцепторов была выбрана так ($E_A^* = 0.08$ эВ), чтобы рассчитанная величина N_a^-

совпала с экспериментально полученной из измерений емкости $N_a^- \approx 10^{18} \, {\rm cm}^{-3}$.

4.1.2. Разрывы зон на гетерограницах. Ширина запрещенной зоны тройных соединений $In_xGa_{1-x}N$ и $Al_yGa_{1-y}N$ может быть вычислена по соотношениям [9]:

$$E_g(\text{InGaN}) = xE_g(\text{InN}) + (1 - x)E_g(\text{GaN})$$
$$-b(\text{InGaN})x(1 - x),$$
$$E_g(\text{AlGaN}) = yE_g(\text{AlN}) + (1 - y)E_g(\text{GaN})$$
$$-b(\text{AlGaN})y(1 - y), \qquad (1)$$

где $E_g(\text{GaN}) = 3.4 \Rightarrow \text{B}$, $E_g(\text{InN}) = 1.9 \Rightarrow \text{B}$, $E_g(\text{AIN}) = 6.22 \Rightarrow \text{B}$ — ширина запрещенной зоны бинарных соединений; *x* и *y* — молярное содержание соответственно In и Al в тройных твердых растворах; $b(\text{InGaN}) = 3 \Rightarrow \text{B}$ и $b(\text{AlGaN}) = 0.5 \Rightarrow \text{B}$ — параметры параболического прогиба зависимостей $E_g(x)$, $E_g(y)$. Мы используем значения *b*, наиболее близко описывающие последние экспериментальные данные работы [9].

Соотношения между разрывами зоны проводимости и валентной зоны на гетерограницах, приводимые в литературе, противоречивы. Расчеты проведены в предположении, что разрывы зоны проводимости ΔE_c и валентной зоны ΔE_v на гетерограницах GaN с твердыми растворами Al_yGa_{1-y}N, In_xGa_{1-x}N — ΔE_c (GaN/AlGaN), ΔE_c (GaN/InGaN), ΔE_v (GaN/AlGaN), ΔE_v (GaN/InGaN) — можно рассчитать по данным [10] для гетерограниц AlN/GaN и GaN/InN:

 $\Delta E_{\nu}(\text{GaN/AlGaN})/\Delta E_{c}(\text{GaN/AlGaN}) = 0.3/0.7,$

$$\Delta E_{v}(\text{GaN/InGaN}) / \Delta E_{c}(\text{GaN/InGaN}) = 0.4/0.6. \quad (2)$$

$E_g(\text{GaN}), \Im B$	x	E_g (InGaN), \Im B	ΔE_g (GaN/InGaN), \Im B	$\Delta E_{v}(\text{GaN/InGaN}),$ 3B	ΔE_c (GaN/InGaN), \Im B
3.40	0.2 0.3	2.62 2.32	0.78 1.08	0.312 0.432	0.468 0.648
$E_g(\text{GaN}), \Im B$	у	$E_g(AlGaN), \Im B$	$\Delta E_g(ext{GaN/AlGaN}), ext{ imes B}$	$\Delta E_{v}(ext{GaN/AlGaN}), ext{3B}$	ΔE_c (GaN/AlGaN), эB
3.40	0.2	3.884	0.484	0.145	0.339

Разрывы зоны проводимости и валентной зоны на гетерограницах GaN/InGaN и GaN/AlGaN

При этом разрывы запрещенных зон на гетерограницах $Al_yGa_{1-y}N/GaN$ и $GaN/In_xGa_{1-x}N$ соответственно равны:

$$\Delta E_c(\text{GaN/AlGaN}) + \Delta E_v(\text{GaN/AlGaN})$$
$$= \Delta E_g(\text{GaN/AlGaN}) = E_g(\text{AlGaN}) - E_g(\text{GaN}),$$

$$\Delta E_c(\text{GaN/InGaN}) + \Delta E_v(\text{GaN/InGaN})$$

= $\Delta E_g(\text{GaN/InGaN}) = E_g(\text{GaN}) - E_g(\text{InGaN}).$ (3)

Принято также, что разрывы 30H не зависят от порядка следования материалов, $\Delta E_{c,v}$ (GaN/AlGaN), $\Delta E_{c,v}$ (AlGaN/GaN) т.е. = $\Delta E_{c,v}(\text{GaN/InGaN}) = \Delta E_{c,v}(\text{InGaN/GaN}).$ Вообще говоря, разрывы зон зависят от последовательности материалов в гетероструктуре [10]. Мы пренебрежем твердых растворов с небольшим ЭТИМ для содержанием Al (y = 0.1-0.2) и In (x = 0.1-0.3) и, следовательно, со сравнительно небольшими разрывами: $\Delta E_g(\text{GaN/InGaN}) = 0.78 - 1.08 \text{ }\text{B}, \ \Delta E_g(\text{GaN/AlGaN})$ $= 0.484 \, \mathrm{sB}.$ Результаты расчетов представлены в таблице.

4.1.3. Эффективная ширина запрещенной зоны. Активная зона гетероструктуры состоит из одной или нескольких квантовых ям InGaN (в нашем расчете — 5), разделенных барьерами GaN; ширина запрещенной зоны рассчитывалась по формулам (1).

Соответственно, для СД при комнатной температуре $(x = 0.2-0.35, T = 300 \text{ K}) E_g(\text{InGaN}) = 2.32-2.62 эВ (см. таблицу, рис. 6). Величина эффективной ширины запрещенной зоны <math>E_g^*$, кроме зависимости $E_g(x, T)$, зависит от положения первых уровней размерного квантования для электронов и дырок в ямах ΔE_{c1} и ΔE_{v1} , от изменений энергий вследствие деформации ΔE_p , от пьезоэлектрических полей ΔE_{pe} , от случайных полей заряженных примесей ΔE_{DA} и от кулоновского взаимодействия электронов и дырок ΔE_{exc} [2]:

$$E_g^* = E_g(\text{InGaN}) + \Delta E_{c1} + \Delta E_{v1} + \Delta E_P + \Delta E_{pe} + \Delta E_{DA} - \Delta E_{\text{exc.}}$$
(4)

Уровни размерного квантования для электронов и дырок в ямах InGaN, разделенных барьерами GaN, можно получить решением уравнения Шредингера в одномерной модели. Множественность квантовых ям приводит к размытию уровней в минизоны. При ширине барьеров $D_b > 35$ Å минизоны имеют ширину менее 1.5 мэВ. С этой погрешностью возможно использовать значения Е_a^{*} из решения уравнений для одиночной прямоугольной квантовой ямы. Вообще говоря, форма ямы изменяется пьезоэлектрическими полями [11], анализ этого влияния здесь не проводится. Зависимости E_g^* от ширины ямы D_w для x = 0.25, 0.30 и 0.35, рассчитанные по формулам (4), приведены на рис. 7. Для x = 0.3 и ширины ям $D_w = 30 \text{ Å}$ уровни размерного квантования электронов находятся на расстоянии $\Delta E_{c1} = 0.17 \, \text{эB}$ от дна зоны проводимости. Уровни размерного квантования для дырок, вследствие сравнительно больших эффективных масс, выше края валентной зоны Е_v на величину $\Delta E_{v1} = 0.08$ эВ; в активном слое МКЯ $E_g^* = 2.52 - 2.54$ B.



Рис. 7. Зависимость эффективной ширины запрещенной зоны E_g^* от ширины квантовой ямы $\ln_x \text{Ga}_{1-x}$ N согласно расчету по формуле (4) с учетом первых трех членов — $E_g(\ln_x \text{Ga}_{1-x}\text{N})$; ΔE_{c1} , ΔE_{v1} . 1 - x = 0.25, 2 - x = 0.30, 3 - x = 0.35. Эллипс соответствует флуктуациям величин E_g^* , D_w ; стрелкой показано положение максимума движущейся спектральной полосы $\hbar\omega_{\text{max}}$.



Рис. 8. Корреляция зависимости коэффициента полезного действия η_P от тока *J* с параметрами модели описания спектров E_0, m для СД *Q* (образец *Q*11).

Флуктуации эффективной ширины запрещенной зоны δE_g^* обусловливаются в основном флуктуациями содержания индия δx и размытием уровней размерного квантования за счет флуктуаций ширины ямы δD_w — см. (1), (4):

$$\delta E_g^* = \sqrt{\left(\frac{\partial E_g^*}{\partial D_w} \,\delta D_w\right)^2 + \left(\frac{\partial E_g^*}{\partial x} \,\delta x\right)^2}.\tag{5}$$

Исходя из (1) и рис. 7 получаем для зависимости $E_g^*(x, D_w)$ в точке x = 0.3, $D_w = 35$ Å наклоны $\partial E_g^*/\partial D_w = 9.26$ мэВ/Å, $\partial E_g^*/\partial x = 2.377$ эВ.

Флуктуации ширины ямы δD_w определяются шероховатостью гетерограниц и мерой их является постоянная решетки $a_{\parallel} = 5.185$ Å [1]. Для $\delta D_w = a_{\parallel}$ имеем $\delta E_g^* = 48$ мэВ. Для $\delta x = 1\%$ получаем $\delta E_g^* = 24$ мэВ и среднестатистические флуктуации ширины запрещенной зоны $\delta E_g^* = 53$ мэВ.

4.2. Модель рекомбинации в хвостах 2D плотности состояний

20

Модель рекомбинации в хвостах 2D плотности состояний подробно обсуждалась в [4]. Она предполагает, что спектральная интенсивность излучения пропорциональна комбинированной 2D плотности состояний вблизи краев зон, имеющих хвосты плотности состояний (N^{2D}), и функциям заполнения состояний f_c и f_v :

$$I(\hbar\omega) \propto N^{2D}(\hbar\omega - E_g^*) \cdot f_c(\hbar\omega, kT, F_n)$$
$$\times \left[1 - f_v(\hbar\omega, kT, F_p)\right],$$
$$N^{2D} \propto \left[1 + \exp(\hbar\omega - E_g^*)/E_0\right]^{-1}.$$
(6)

Формула (6) хорошо описывает спектры СД на основе гетероструктур InGaN/AlGaN/GaN с квантовыми ямами [2–6], но имеет 6 параметров. В области рабочих токов функция заполнения электронных состояний $f_c(\hbar\omega, kT, F_n)$ вблизи E_c близка к 1. Принимая такое упрощение, получаем 4-параметрическую модель описания формы спектров. Важно, что параметры энергетической диаграммы (п. 4.1) дают ясный физический смысл параметрам в формулах (6).

1) $E_g^* = 2.5 - 2.7 \ \text{эB} -$ эффективная ширина запрещенной зоны, соответствующая расстоянию между уровнями размерного квантования в ямах;

2) $E_0 = 50-60$ мэВ — показатель экспоненциального спада комбинированной 2D плотности состояний; его величина соответствует флуктуациям: $E_0 \approx \delta E_e^*$;

3) $E_1 = mkT = 1.35 - 1.55kT$ — показатель экспоненты с коротковолновой стороны, характеризующий функции заполнения электронов и дырок;

4) $\Delta F_p = F_p - E_v$ — положение квазиуровня Ферми для дырок.

Результаты аппроксимации спектров электролюминесценции на основе этой модели представлены на рис. 1.

4.3. Сдвиг максимума основной полосы с током

Расстояние между дном зоны проводимости и потолком валентной зоны в квантовых ямах $In_{0.3}Ga_{0.7}N$ равно 2.36–2.40 эВ. Оно соответствует максимуму "стоящей" спектральной полосы. Пока приложенное к активной области напряжение U таково, что $\Delta F = F_n - F_p = eU < 2.36$ эВ, излучательная рекомбинация идет между локализованными уровнями в хвосте плотности состояний вблизи краев зон E_c и E_v . При бо́лыших напряжениях, eU > 2.36 эВ, (и при соответствующих токах) локализованные уровни оказываются заполненными. Спектральный максимум основной полосы сдвигается по мере повышения тока линейно с напряжением и с положением квазиуровня Ферми для дырок — с изменением ΔF_p заполняются делокализованные состояния в хвосте валентной зоны. В области напряжений U = 2.36 - 2.95 В ток *J* коррелирует с положением квазиуровня Ферми для дырок ΔF_p , полученным из формы спектров: $J \propto \exp(\Delta F_p/kT)$. Это объясняется тем, что 4-параметрическая модель описания спектров включает в себя функцию распределения для дырок (предполагается, что $f_c(\hbar\omega, kT, F_n) = 1$). Таким образом, ток пропорционален концентрации дырок, инжектированных в активную область,

$$\delta p = N_v^{\text{2D}} \exp(\Delta F_p / kT). \tag{7}$$

4.4. Квантовый выход излучения

Параметры описания формы спектров E_0 и $E_1 = mkT$ слабо изменяются с изменением тока: Е0 — от 56 до 63 мэВ; *m* — от 1.35 до 1.55. На рис. 8 изображены зависимости E_0 , *m* и η_P от тока для одного из СД Q. Видно, что максимум η_P соответствует минимуму E_0 , $E_1 = mkT$. Небольшие изменения E_0 и E_1 свидетельствуют об изменении относительной роли механизмов излучательной рекомбинации — происходит она между локализованными или делокализованными состояниями. Преобладает ток через микрообласти с характерным значением флуктуаций потенциала Е₀, эти области могут изменяться в некоторых пределах с изменением J и U. Рост E_1 при повышении тока может свидетельствовать также о нагреве структуры [12]. Максимум квантового выхода достигается на границе областей ВАХ с инжекционным и туннельным механизмами рекомбинации при U = 2.54 В. Максимум квантового выхода соответствует тем меньшему току, чем меньшую роль играют туннельные эффекты.

5. Заключение

1. Небольшие различия (±10%) квантового выхода излучения СД на основе гетероструктур InGaN/AlGaN/GaN с МКЯ связаны с различиями распределения эффективных заряженных центров в области пространственного заряда и с разной ролью туннельной компоненты тока при малых напряжениях.

2. Значения характерных энергий в спектрах излучения и напряжений на ВАХ зеленых СД соответствуют: началу туннельного излучения ($\hbar\omega = eU = 1.90 \pm 0.05$ эВ), максимуму "стоящей" полосы ($\hbar\omega_{\rm max} = 2.36 \pm 0.01$ эВ), эффективной ширине запрещенной зоны для "движущейся" полосы ($E_g^* = 2.54 \pm 0.01$ эВ) и контактной разности потенциалов в численном описании ВАХ (U = 2.9-3.1 В).

3. Расчет энергетической диаграммы показывает, что величина $eU = 1.90 \pm 0.05$ эВ соответствует барьеру для перехода дырок из *p*-области в активную область. Величины 2.36 ± 0.01 и 2.54 ± 0.01 эВ соответствуют энергии $E_c - E_v$ и эффективной ширине запрещенной зоны в квантовых ямах InGaN.

4. Феноменологическая модель количественно описывает спектры СД. Физический смысл 4 параметров: E_g^* — эффективная ширина запрещенной зоны; $E_0 = 50-60$ мэВ соответствует флуктуациям величины E_g^* ; $E_1 = mkT = 1.35-1.55kT$; параметр ΔF_p квазиуровень Ферми для дырок.

5. Стоящая полоса люминесценции с максимумом при 2.36 эВ соответствует рекомбинации между локальными состояниями вблизи краев зон в квантовых ямах, движущаяся — рекомбинации между делокализованными состояниями.

6. Максимум зависимости коэффициента полезного действия от тока коррелирует с минимумами зависимостей параметров E_0 и E_1 от тока. Он определяется конкуренцией инжекционного и туннельного токов.

Авторы выражают благодарность д-ру П. Мартину (лаборатория фирмы Hewlett Packard) за предоставление образцов светодиодов; О.А. Шустину и Л.С. Ловинскому за помощь в измерениях мощности излучения.

Список литературы

- S. Nakamura, G. Fasol. *The Blue Laser Diode* (Springer, Berlin, 1999).
- [2] К.Г. Золина, В.Е. Кудряшов, А.Н. Туркин, А.Э. Юнович. ФТП, **31** (9), 1055 (1997).
- [3] В.Е. Кудряшов, К.Г. Золина, А.Н. Ковалев, Ф.И. Маняхин, А.Н. Туркин, А.Э. Юнович. ФТП, **31** (11), 1304 (1997).
- [4] Ф.И. Маняхин, А.Н. Ковалев, В.Е. Кудряшов, А.Н. Туркин, А.Э. Юнович. ФТП, **32** (1), 63 (1998).
- [5] В.Е. Кудряшов, А.Н. Туркин, А.Э. Юнович, А.Н. Ковалев, Ф.И. Маняхин. ФТП, 33 (4), 445 (1999).
- [6] A.E. Yunovich, V.E. Kudryashov, S.S. Mamakin, A.N. Turkin, A.N. Kovalev, F.I. Manyakhin. Phys. St. Sol. (a), **176** (1), 125 (1999).
- [7] S.F. Chichibu, S.P. DenBaars, K. Wada, M. Aritta, T. Sota, S. Nakamura et al. Mater. Sci. Eng. B, 59, 298 (1999).
- [8] P.G. Eliseev, P. Perlin, J. Lee, M. Osinski. Appl. Phys. Lett., 71 (5), 569 (1997).
- [9] B. Monemar, J.P. Bergman, J. Dalfors, G. Pozina, B.E. Sernelius, P.O. Holtz, H. Amano, I. Akasaki. MRS Internet J. Nitride Semicond. Res., 4, 16 (1999).
- [10] F. Bernardini, V. Fiorentini. Phys. Rev. B, 57 (16), R9427 (1998).
- [11] A. Hangleiter, J.S. Im, H. Kollmer, O. Gfrorer, J. Off, F. Scholz. MRS Internet J. Nitride Semicond. Res., 4S11, G6.20 (1999).
- [12] V. Schwegler, S.S. Schad, C. Kirchner, M. Seybouth, M. Kamp, K.J. Ebeling, V.E. Kudryashov, A.N. Turkin, A.E. Yunovich, U. Stempele, A. Link, W. Limmler, R. Sauer. Phys. St. Sol. (a), 176, 783 (1999).

Редактор Л.В. Шаронова

Spectra and quantum efficiency of light-emitting diodes based on GaN heterostructures with quantum wells – dependence on current and voltage

V.E. Kudryashov, S.S. Mamakin, A.N. Turkin, A.E. Yunovich, A.N. Kovalev⁺, F.I. Manyakhin⁺

Moscow State Lomonosov University,

119899 Moscow, Russia

⁺ Moscow Institute of Steel and Alloys,

117235 Moscow, Russia

Abstract Spectra and quantum efficiency η_e of green LEDs based on heterostructures InGaN/AlGaN/GaN with miltiple quantum wells have been studied at currents $J = 10^{-6} - 10^{-1}$ A. Minor differences in η_e (of $\pm 10\%$ at $J \approx 10$ mA) are caused by sufficiently different distribution of effective charges in the space charge regions as well as by different role of the tunnel component of J at low voltages. A tunnel radiation band is revealed in the long wavelength range (1.93-2.03 eV) in the LEDs with a thin space charge region ($w \le 120 \text{ nm}$). Maximum of tunnel band corresponds to the voltage ($\hbar\omega_{max} = 1.92 - 2.05 \,\text{eV}$). The main peak in spectra at low J ($\hbar\omega_{max} = 2.35 - 2.36 \,\text{eV}$) does not depend on the voltage and is explained by radiative transitions in localized states. At J > 1 mA the spectral band shifts with J $(\hbar\omega_{\rm max}=2.36{-}2.52\,{\rm eV})$. The model of 2D structures with band tails describes satisfactory the band form with 4 tiffing parameters. The band tails are due to microscopic potential fluctuations. The energy diagram of the heterostructure with MQW is calculated; it explains parameters of 2D-tail's model.